

POLSKA UNIA METROLOGICZNA

SEMINARIUM METROLOGICZNE

SEMINARIUM METROLOGICZNE

Inteligentne rozwiązania metrologiczne dla przemysłu przyszłości x.0

20.03.2024, sala E-3, Targi Kielce,

Program seminarium

od 9:00	Rejestracja – tryb ciągły
9:30 – 9:40	Jerzy Józwik – Polska Unia Metrologiczna, Politechnika Lubelska Otwarcie seminarium
9:40 – 10:00	Przedstawiciel Kierownictwa GUM – Główny Urząd Miar Działalność Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar ukierunkowana na współpracę z przemysłem
10:00 – 10:20	Magdalena Zawada – Michałowska – Politechnika Lubelska Diagnoza stanu metrologii w Polsce
10:20 – 10:40	Michał Wieczorowski, Bartosz Gapiński – Politechnika Poznańska Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej - Laboratorium Politechniki Poznańskiej
10:40 – 11:00	Adam Brzozowski – Główny Urząd Miar Ciśnienie dynamiczne – nowa dziedzina pomiarowa
11:00 – 11:50	Uchonorowanie 25-lecia firmy ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
11:50 – 12:10	Wojciech Batko, Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski – Politechnika Świętokrzyska Analiza niepewności przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku
12:10 – 12:30	Grzegorz Krajewski – Renishaw Sp. z o.o. Inteligentne pomiary międzyoperacyjne. Kontrola przemieszczeń i położenia
12:30 – 12:50	Witold Siemieniako – Hexagon Metrology Sp. z o.o. Kompleksowe podejście Grupy HEXAGON do rozwiązania problemów metrologicznych bezpośrednio na obrabiarkach. Zastosowanie nowej generacji rozwiązań metrologicznych
12:50 – 13:10	Dominik Szała – Carl Zeiss Sp. z o.o. Automatyzacja pomiarów współrzędnościowych w kontroli jakości
13:10 – 13:30	Piotr Ziółkowski, Andrzej Kiercz – Główny Urząd Miar, Targi Kielce SA Klaster Metrologiczny - nowe wyzwania i inicjatywy
13:30 – 13:50	Piotr Orlik – Siemens Inteligentne rozwiązania pomiarowe w sterowaniu SINUMERIK
13:50 – 14:10	Marcin Adamiak – Politechnika Śląska Nowoczesne technologie i metody badań materiałów inżynierskich
14:10 – 14:30	Grzegorz Budzik, Grzegorz Królczyk, Michał Wieczorowski – Politechnika Rzeszowska Metodyka pomiarów geometrycznych obiektów wytwarzanych przyrostowo
14:30 – 14:50	Paweł Chrapowicki – Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska w erze cyfryzacji i sztucznej inteligencji
14:50 – 15:10	Dariusz Brzozowski – ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Skanery laserowe CREAMFORM oraz tomografy komputerowe WAYGATE w aplikacjach przemysłowych
15:10 – 15:30	Anna Gębarska – Smarttech Sp. z o.o. Dlaczego automatyzacja i skanowanie 3D z kolorem są istotne dla przemysłu x.0



POLSKA UNIA
METROLOGICZNA



Minister
Nauki



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego



POLITECHNIKA
LUBELSKA



Główny
Urząd
Miar



Targi Kielce
exhibition & congress centre